Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U003166

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-12-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Владімірова Тетяна Петрівна

2. Vladimirova Tetyana Petrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 16-11-2000

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 36

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.168.02

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 36

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.11, 29.19.19

Тема дисертації:

1. Двокристальна рентгенівська дифрактометрія в діагностиці монокристалів з декількома типами мікродефектів довільних розмірів

2. Double crystal X-ray diffractometery in diagnostics of single crystals with several types of microdefects of arbitrary sizes

Реферат/анотація:

1. Розроблено новий метод повних кривих дифракційного відбиття (КДВ) на основі створення нової теоретичної моделі для опису повної КДВ, що включає окіл точного бреггівського положення. Ця модель базується на використанні ряда виконаних у роботі узагальнень динамічної теорії розсіяння рентгенівських променів у кристалах з хаотично розподіленими дефектами кулонівського типу, які полягають у врахуванні динамічного характеру дифузного розсіяння (ДР) при аналітичному інтегруванні ДР по сфері Евальда, у врахуванні наявності в кристалі одночасно декількох типів дефектів довільних розмірів, а також у врахуванні інструментальних факторів розробленої рентгенооптичної схеми двокристального дифрактометра. Для реєстрації КДВ в таких випадках створено високороздільний (трьохосьовий), чотирикружний, автоматичний дифрактометр, на якому зібрані оригінальні рентгенооптичні схеми. В дисертації виявлено і описано осциляції інтенсивності асимптотичного ДР, які дозволили суттєво підвищити надійність визначення

параметрів дефек тів. Показані однозначність, високі чутливість і інформативність діагностики розробленим методом.

2. The new theoretical model for description of full X-ray diffraction rocking curves (RC) that includes the vicinity of exact Bragg position has been developed. The model is based on generalizations of the X-ray diffraction dynamic theory for crystals with chaotically distributed Coulomb type defects made in this work. This generalizations lean upon considering the dynamic character of diffuse scattering (DS) in the course of analytical integration of DS over the Evald sphere, the account of the simultaneous presence of several types of defects with arbitrary sizes in the crystal, and also on tool factors of the elaborated X-ray optical scheme of the double crystal diffractometer. For RC recording in such cases, the high-resolution (triple-axis), four-circle, automated diffractometer was designed.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кисловський Євген Миколайович
2. Кисловський Євген Миколайович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Даценко Леонід Іванович

2. Даценко Леонід Іванович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Репецький Станіслав Петрович

2. Репецький Станіслав Петрович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Немошкаленко Володимир Володимирович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Немошкаленко Володимир Володимирович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.